

NanoX-Perience XPS

Seminar:

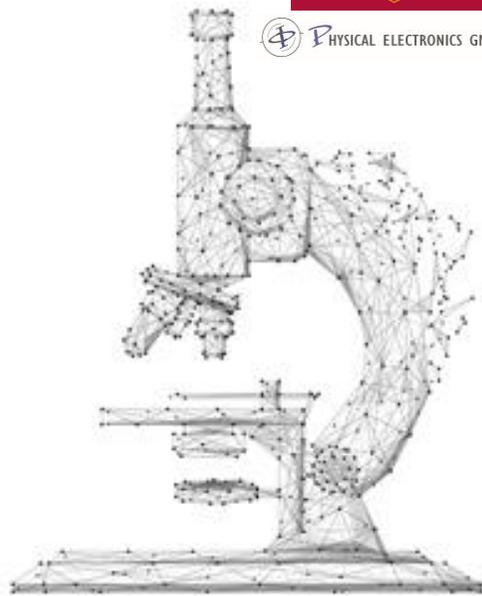
Neueste Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) inklusiver Augerelektronenspektroskopie (AES) Option kombiniert an der VersaProbe III am Institut für Physik, Universität Osnabrück

Fokus: Charakterisierung von dünnen Schichten und Grenzflächen

Datum: 15 Mai. 2019

Ort: Universität Osnabrück, Barbarastr. 7, 49076 Osnabrück; Institut für Physik Raum32/111

Gastgeber Universität Osnabrück in Kooperation mit Physical Electronics GmbH



Neue Erfahrungen + Erfahrungsaustausch

- ❖ Erfahren Sie mehr über die Röntgenphotoelektronen- und Augerelektronenspektroskopie Technologie
- ❖ Erfahren Sie mehr über die Universität Osnabrück, Fakultät für Physik
- ❖ Lernen Sie Physical Electronics GmbH als Partner kennen
- ❖ Nutzen Sie die Möglichkeit für Networking und Wissensaustausch

Ziel:

Erfahrungsaustausch bei der Forschung von Nanoteilchen und Nanoteilchenverbunden mittels XPS. Lernen Sie das neueste XPS System, die Versa Probe III von Physical Electronics USA an der Universität Osnabrück kennen. Inklusiver einzigartiger Auger Option. Staunen Sie über die aktuellsten Produkterweiterungen/ Optimierungen in der Oberflächenanalytik; Neue Forschungsansätze; Direktes Feedback von den Experten und Kollegen; Knüpfen Sie neue Kontakte

Fokus:

Photoelektronen- und Augerelektronenspektroskopie Technologie zur Charakterisierung von dünnen Schichten und Grenzflächen; Wie erzielt man die Mikrostrukturanalyse, Oberflächenmorphologie und optische Eigenschaften in den gewachsenen Filmen mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS)?



Arbeitsgruppe Dünne Schichten und Grenzflächen Forschung

- ❖ Herstellung und Charakterisierung ultradünner epitaktischer Schichten
- ❖ Strukturelle, elektronische und magnetische Eigenschaften ultradünner Oxidschichten und -Schichtsysteme
- ❖ Charakterisierung selbstorganisierte Metall- und Silizidnanodrähte
- ❖ Untersuchungen mit Synchrotronstrahlung: Beugung, Reflexion und Spektroskopie

Die Arbeitsgruppe "elektronische Struktur (Experiment)" befasst sich mit

- ❖ Elektronischen und magnetischen Eigenschaften neuer Materialien. Als experimentelle Techniken werden dabei Magnetometrie (SQUID, VSM), Rasterelektronenmikroskopie (REM-EDX), Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS, HAXPES) sowie Synchrotron basierte Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAS, XMCD) eingesetzt.
- ❖ Charakterisierung der besetzten (Valenzband) und unbesetzten Zustände (Leitungsband)
- ❖ Zudem können mittels der kernnahen Spektren Rückschlüsse auf den Valenzzustand und die lokale Koordinierung einzelner Ionen im Molekül oder Festkörper gezogen werden.

PHI VersaProbe III



Mittwoch 15. Mai 2019 am Physik-Institut der Universität Osnabrück

Moderation Stefanie Zauzig

09:30-10:00 Registrierung und Willkommen Universität Osnabrück (Kaffee und Snacks)

10:00-10:30 Willkommen durch Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger & Dr. rer. nat. Karsten Küpper und Vorstellung Universität Osnabrück

10:30-11:00 Erfahren Sie mehr über die XPS Forschungs und Aufgabengebiete an der Universität Osnabrück

11:00-11:15 Vorstellung Physical Electronics GmbH durch Tobias Schütz

11:15-12:00 XPS Anwendungstalk Talk Dr. Andrey Lyapin

12:00-13:00 Mittagspause

13:00-14:30 Lab Tour Universität Osnabrück und Praktischer Teil an der VersaProbe III (abwechselnd in kleinen Gruppen) Mitarbeiter Uni Osnabrück + Dr. Andrey Lyapin

14:30-15:00 Kaffeepause

15:00-15:30 Talk Uni Osnabrück (TBA)

15:30-16:15 Vorstellung Kombination XPS/HAXPES durch Physical Electronics GmbH

16:15-16:30 Fragen & Antworten

16:30 Ende des Seminars

Das Seminar ist kostenlos, inklusive Catering und Informationsmaterial. Zur Teilnahme müssen alle Teilnehmer registriert sein.

Registrierung mittels E-Mail: szauzig@phi-europe.com

Registrierung bis 03. 05. 2019

_____ Name

_____ Firma

_____ Department/Position

_____ Straße

_____ PLZ

_____ Tel./Fax

_____ E-Mail

Die Datenschutzerklärung <https://phi-gmbh.eu/privacy-policy/> habe ich zur Kenntnis genommen.

Speicherung der Daten

Ja, hiermit bestätige ich das Physical Electronics GmbH im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen, meine persönlichen Daten elektronisch speichern darf. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

_____ Datum, Unterschrift

Gastgeber und Organisation

❖ Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger
Arbeitsgruppe Dünne Schichten und Grenzflächen
Universität Osnabrück

❖ Dr. rer. nat. Karsten Küpper
Arbeitsgruppe "elektronische Struktur (Experiment)"
Universität Osnabrück

❖ M.Sc. – Dipl.-Ing. Stefanie Zauzig
Marketing
PHI GmbH

Speakers

❖ Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger
Universität Osnabrück

❖ Dr. rer. nat. Karsten Küpper
Universität Osnabrück

❖ Dr. Andrey Lyapin
Labor Wissenschaftler
PHI GmbH

❖ Dipl.-Ing. Tobias Schütz
Sales
PHI GmbH

Kontakt Daten

szauzig@phi-europe.com
<http://phi-gmbh.eu/>
+49-89-96-275-0
Fraunhoferstraße 4
D-85737 Ismaning

